

Tirsdag den 27. august, 2002

NTF temadag: AOI/AXI - Automatiske inspektionssystemer til elektronikproduktion

Nordisk Test Forum afholder temadag om Automatisk inspektionssystemer. microLEX Systems A/S, Hørsholm, DK, står som arrangør.

Automatiske Optiske Inspektionssystemer, AOI, og tilsvarende Automatiske X-ray Inspektionssystemer, AXI, har undergået en rivende udvikling siden midten af 1990'erne. I dag anvender mange produktionsvirksomheder for elektronik sig af AOI eller AXI, med rigtig gode resultater, og endnu flere virksomheder står på spring til at udnytte disse lovende inspektionsteknologier. AOI og AXI overtager hurtigt mange af de opgaver, som fx In-Circuit Test, ICT, tidligere varetog. Ikke mindst i forbindelse med mange af de nye, og meget tætte pakningsteknologier, viser AOI og AXI sig uovertrufne.

Men hvad skal man vælge, hvor ligger problemerne, og ikke mindst hvad betyder de mange forbedringer i inspektionsteknologi, som ser dagens lys i disse år? Der kommer til stadighed nye features og leverandører på markedet, og der er lidt for enhver pengepung.

Seminaret sigter mod at give svar på mange af disse udfordrende spørgsmål. NTF har sammensat et nuanceret program for dagen, hvor der er god balance mellem leverandører og erfarne brugere af AOI & AXI. Samtidigt har vi tilstræbt at præsentere løsninger og erfaringer med såvel med dyre og særdeles effektive systemer som løsninger i mellemklassen og helt ned i den billige ende af prisspektret. Hver løsningsteknologi har sine fordele og ulemper.

Kom og hør eksperterne og deltag i den åbne dialog omkring AOI og AXI i moderne elektroniske produktionssystemer. Næsten uanset hvilken baggrund, du kommer med, så er der noget at lære på dagen. Vi har også en lille mini-udstilling, hvor du kan få lejlighed til at diskutere med flere af markedets førende leverandører af AOI og AXI.

Snyd ikke dig selv for en god mulighed til at komme på forkant med et par af vore dages førende inspektionsteknologier og få styr på, hvor AOI eller AXI passer ind i moderne PCB produktion.

Program

Tid	Varighed	Tema	Presentatør
09:30	00:30	Registrering og kaffe	
10:00	00:30	Velkomst & indledning	Birger Schneider, microLEX
10:15	00:30	"Solder Paste AOI inspection systems - a means of achieving efficient QC"	Reinhard N. Nitz, Nutek
10:45	00:30	"Erfaring med optimering af produktions-kvalitet hos Bang & Olufsen ved hjælp af AOI".	Jesper Clausen, B&O
11:15	00:30	"Improved efficiency in AOI inspection using advances in optical inspection"	Lars Kaas, Viscom-Nordic
11:45	00:30	"HyperVison - an approach towards higher throughput, shorter programming - at an affordable cost"	Reinhard N. Nitz, Nutek

12:15	00:45	Lunch	
13:00	00:30	"Fokuseret og effektivt AOI til et lav budget ved hjælp af National Instruments IMAQ vision"	Birger Schneider, microLEX
13:30	00:30	"2D eller 3D image i effektiv AXI inspektion"	Boris Høstman, Kontest
14:00	00:30	"Erfaringer med AXI i produktionen hos Kitron"	Trond Knutsen, Kitron Arendal
14:30	01:00	Kaffe & udstilling	
15:30	00:30	"Comparing AXI versus AOI, when to use the technology and what advantages are of one over the other"	Hans-Walter Gillmann, Agilent
16:00	00:30	"Bruger erfaring med Agilent AXI"	N.N.
16:30	00:15	"Wrap-up & afslutning af AOI/AXI Temadagen"	NTF formand Knut Båstøløkken, Kitron Arendal,

Deltagerafgift: 500 DKK

Sted: DGC kursuscenter
Dr. Neergaards Vej 5A
DK-2970 Hørsholm
Danmark

Lokal NTF arrangør: Birger Schneider
microLEX Systems A/S
Dr. Neergaards Vej 5C
DK-2970 Hørsholm
Danmark
Tel.: +45-45 76 21 00
Fax: +45-45 76 22 00
Email: bsc@microlexsys.com
Web: www.microlexsys.com

Tilmelding: microLEX Systems **senest 20. August 2002.**

Tilmelding:	Tel.: +45-45 76 2100	Fax: +45-45 76 22 00	Email: sho@microlex.dk
Firma/institution:			
Adresse:			
Post Nr.:		By:	
Telefon:		Email	
Antal deltagere:		Navne:	